

立中央大學八十九學年度碩士班研究生入學

別： 地球物理研究所 不分組 科目： 地球物理探勘學 共 1 頁
應用地質研究所

一. 定義或說明下列名詞。(15%)

- (1) 斯涅爾定律 (Snell's law)
- (2) 同中點重合 (common-midpoint stack)
- (3) 電磁場的皮深 (skin depth of electromagnetic fields)

二. 試述反射震測之原理，以二水平層為例說明如何決定速度與厚度。(15%)

三. 試述折射震測之原理，以二水平層為例說明如何決定速度與厚度。(15%)

四. 如何做重力測勘之 (1)自由空間修正 (free-air correction),
(2)布蓋修正(Bouguer correction)，並述其意義。(15%)

五. 試述直流電阻法 (direct current resistivity method) 之測勘原理。(15%)

六. 何謂地磁場的 (1)長期變化 (secular variation), (2)日變化(diurnal variation)？
在何情況磁測資料需作上述兩種變化之修正？(15%)

七. 試述迴旋 (convolution) 與線性濾波(linear filtering)之意義。(10%)